モルフォロジカルスケルトンによる3次元画像の構造解析

入山 彰夫 剣持 雪子 小谷 一孔

北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 〒923-1292 石川県能美郡辰口町旭台 1-1 E-mail: {akio-iri, kenmochi, ikko}@jaist.ac.jp

あらまし近年,3次元画像の利用機会の増加に伴い,それらを対象とした形状認識手法が求められている. これまで様々な研究が行われたが,従来手法では形状認識を階層的に行う事は困難であった.階層的な認識を 行うには,形状を階層的に表す特徴情報を得る必要がある.階層的な画像表現手法として,多重解像度表現が 一般的であるが,多重解像度表現では低解像度ほど特徴情報のロバスト性が低いという問題がある.本研究で は,認識処理上のロバスト性を考慮した,モルフォロジカルスケルトンに基づく新たな特徴情報(SIMS)を提 案する.SIMSにより階層的な認識が可能であることを示し,その分解能を定量的比較に基づき検証する.

キーワード 3次元画像処理,モルフォロジ,スケルトン,SIMS,多重解像度表現

Structural Analysis of 3D Digital Shape Using Morphological Skeleton

Akio IRIYAMA, Yukiko KENMOCHI, and Kazunori KOTANI

School of Information Science, JAIST Asahidai 1-1, Tatsunokuchi-machi, Nomi-gun, Ishikawa, 923-1292 Japan

E-mail: {akio-iri, kenmochi, ikko}@jaist.ac.jp

Abstract We propose a new feature extraction method called SIMS to analyze 3-D digital shapes. It is possible by using SIMS that the hierarchical analysis of 3-D digital shapes. It was difficult for performing recognition hierarchicaly by the conventional method using multi-resolution analysis. Because it has no robustness to phase change or a spatial change in low resolution. SIMS has robustness that needs to perform hierarchical recognition. SIMS is based on a Morphological skeleton. We verified the character of SIMS by quantitive experiment.

Key words 3-D Digital Shape, Morphology, Morphological Skeleton, SIMS, multi-resolution

1. はじめに

CT スキャナやレーザーレンジファインダ等に代 表される3次元スキャナの普及に伴い,ボリューム データの利用機会はますます増加している.これに 伴い,ボリュームデータを対象とした形状認識手法 も求められているが,ボリュームデータは膨大なデ ータ量を持ち,またボリュームデータで表された3 次元形状そのものも形としての複雑さを持つため, 形状認識を行う事は容易ではない.このため,形状 認識を行うための様々な手法がこれまで研究されて きた.

形状認識は、形状から何らかの特徴情報を抽出し, 得られた特徴情報を元にあるクラスを基準として分 類するという過程に分けられる.様々な特徴情報が 提案されているが,その一つとして対象画像をテン プレート形状の集合で表し,その分布を特徴情報と する手法がある.ボクセル表現されたオブジェクト に対し,テンプレート形状とのマッチングを行う手 法として,大域的な検索をGAやハフ変換を用いて 効率的に行う手法[1][2]がある.また,動的輪郭法を 用いてボクセル表現されたオブジェクトを球面の集 合で代表し,それを特徴情報とする事で,オブジェ クトの概形表現や領域抽出を行う手法[3][4]がある. 一方,ボクセル表現されたオブジェクトに3次元細 線化を行い,得られた形状の骨格情報を特徴情報と して形状分類を行う手法[5]も提案されている.これ らの手法により得られる特徴情報は,形状特徴を階 層的に表すものではないため,認識処理も階層的に 行う事はできない.

これに対し,形状特徴を階層的に表す特徴情報と して多重解像度表現された画像を用いてオブジェク ト分割を行う手法[6]が提案されている.しかし,オ ブジェクトを多重解像度表現する事で階層的な解析 処理が可能であるが,低解像度においてオブジェク トの空間的・位相的変化に対するロバスト性が低い ため,形状認識に適した特徴情報とは言えない.

多重解像度表現とは異なる形状特徴を階層的に表 す特徴情報にモルフォロジカルスケルトンがある. モルフォロジカルスケルトンは,モルフォロジー演 算[7][8]により得られる形状の骨格情報である.これ は細線化により得られる骨格情報とは異なり,モル フォロジー演算は可逆変換であるため,スケルトン は元形状の情報を完全に保持する.しかし,スケル トンも座標空間中の画素集合として表されるため, 空間的・位相的な変化に対するロバスト性が低い. そこでスケルトンを極座標系に置き換え,形状認識 に適した特徴情報として新たに SIMS (Structure Information based Morphorogical Skeleton)を提 案する.SIMS の性質及び分解能を調べ,その結果 を報告する.なお簡略化のため説明は主に2次元画 像により行う.

2. モルフォロジカルスケルトン

モルフォロジカルスケルトンはモルフォロジー演算により求められ,スケルトンは元画像の情報を完全に保持する.以下,スケルトン化手法及びスケルトンの性質について説明する.

2.1 モルフォロジーに基づくスケルトン化

スケルトン化は,モルフォロジー演算における基 本演算であるミンコフスキー和とエロージョンの組 み合わせで構成される.各演算は画像と構造要素と の論理演算として定義される.構造要素とは複数の 位置ベクトルの集合を画素に置き換えたものであり, 構造要素の形状に依存してスケルトン化結果は変化 する.本研究では特に安定したスケルトン化が行え る円(3次元では球)を構造要素として用いる.画像 A, 構造要素 B,それぞれの集合要素を $a \in A$, $b \in B$, Bの対称集合を B^{S} とする.ユークリッド空間を Eとすると, $A \ge B$ のミンコフスキー和,エロージョ ンは演算子+, \circ を用いてそれぞれ式(1),(2)で表さ れる.

 $A \oplus B = \{ \mathbf{z} \in E : \mathbf{z} = \mathbf{a} + \mathbf{b}, \quad \mathbf{a} \in A, \quad \mathbf{b} \in B \}$ (1)

$$A \circ B^{S} = \{ \mathbf{x} \in E : \mathbf{x} - \mathbf{b} \in A, \quad \forall \mathbf{b} \in B^{S} \}$$
(2)

 $A のスケルトン SK(A)は式(3)で表される.ただし A のスケルトン部分集合 <math>S_n(A)$ は式(4) で表され,nB はB のn 回ミンコフスキー和であり式(5)のように表 される.ここではnをスケールと呼ぶ.

$$SK(A) = \bigcup_{n=0}^{N} S_n(A)$$
(3)

$$S_n(A) = (A \circ nB^3) - (A \circ (n+1)B^3) \oplus B$$
(4)

$$nB = B \oplus B \oplus \dots \oplus B \oplus B \tag{5}$$

2.2 モルフォロジカルスケルトンの性質

スケルトンは,スケルトン部分集合の論理和として表され,スケルトン部分集合は互いに素である. スケルトン部分集合 $S_n(A)$ と元画像Aとの関係は式(6)で表され,スケルトンから元画像を完全復元可能である.スケールnのスケルトン部分集合は,構造要素 Bによるn回分のミンコフスキー和を含む. このためスケール値が大きいスケルトン部分集合ほど,元画像における大局的情報を表し,逆にスケール値が小さいスケルトン部分集合は局所的情報を表す.

$$A = \bigcup_{n=0}^{N} \left[S_n(A) \oplus nB \right]$$
(6)

スケルトン部分集合 *S_n*(*A*)は,構造要素*B*による *n*回ミンコフスキー和分の領域を代表しているため, スケルトンを用いることで元画像よりも少ないデー タを解析対象とする事ができる.また,スケルトン はスケール値によって階層化された情報であり,階 層的な解析処理が可能である.スケルトンの階層性 はスケールで表され,構造要素により変化する.2 次元画像に対して,構造要素を円に限定した場合, 円の半径が大きいほど階層性は減少し,スケルトン 部分集合一つあたりの分布が増大する.この例とし て,図1(a)に示す三角形を半径3[pixel]の円と半径 11 [pixel]の円形構造要素によりスケルトン化した 結果をそれぞれ図1(b)(c)に示す.



(a)元画像 (b)半径3の場合 (c)半径11の場合 図1.構造要素の違いによるスケルトン分布の変化

3. SIMS

スケルトン分布の形状ごとの違いから形状認識を 行う事が可能であるが,スケルトンは座標空間中の 画素集合として表されるため,元画像の空間的・位 相的変化に対するロバスト性は低い.このため,本 研究ではスケルトンを元に認識に適した特徴情報へ の変換を提案する.変換後の特徴情報を特に SIMS(Structure Information based Morphorogical Skeleton)と呼ぶ.

3.1 スケルトンから SIMS への変換

画像に対して距離変換[9]を行った場合,スケルト ンは距離値が極大となる点を中心として放射状に広 がった分布を示す.そして形状中心に近いほど,よ り大きなスケール値のスケルトン部分集合が分布す る.このような分布特性からスケルトンを中心点か らの広がりを表すパラメータとして考える事ができ る.そして,中心点からの位相と広がりでスケルト ンを表すことで,元画像の空間的・位相的変化に対 するロバスト性が得られる.

そこで,スケルトン部分集合 $S_n(A)$ を中心点Oから極座標系の位相 - 広がり空間へ変換する.スケルトン部分集合 $S_n(A)$ に属する点を P_n とし,Oより角度 方向上にあり OP間の距離が最小となる点をmin P_n , OP間の距離が最大となる点を max P_n とする.min P_n とmax P_n の2点間の距離を,角度 方向の広がり m_n として次式(7)で定義する.

$$m_n = \max \left| \overrightarrow{OP_n} \right| - \min \left| \overrightarrow{OP_n} \right|$$
(7)

この定義に基づき,各位相についてそれぞれのス ケルトン画素から広がり*m*を求める.例を図2に示 す.図2(a)に示すスケルトン部分集合 $S_n(A)$ の場合, そのSIMS は図2(b)のようになる.この変換により, 各スケルトン部分集合の広がり*m*が図2(b)のように 位相 $(-\pi \le \theta \le \pi)$,広がり*m*のパラメータ空間 上で表される.但し位相はx軸正方向を基準0とす る.



3 次元画像を対象とした場合は,スケルトンも中 心点から3次元的に分布する.中心点からの位置ベ クトルがデカルト座標系において(x, y, z)で表され る時,SIMS は極座標系の (r, θ, φ) で表され,それ ぞれの対応関係は式(8)(9)(10)で表される.

$$x = r\sin\theta\cos\varphi \tag{8}$$

$$y = r\sin\theta\sin\varphi \tag{9}$$

$$z = r\cos\theta \tag{10}$$

3次元画像に対して実際に SIMS を求め, 極座標 空間に置き換えた例を図3に示す.



図3.3次元画像における SIMS

3.2 離散空間におけるスケルトンから SIMS への変換

実際にスケルトンに対して SIMS への変換処理を 行う場合,処理対象となるスケルトンは離散空間に おける画素の集合として表されるため,厳密に式(7) の定義に沿った SIMS への変換を行う事はできない. スケルトン部分集合 S₄(A) を対象とする実際の SIMS への変換処理は、次の4つの過程で行われる. それぞれの番号は図4(a),(b),(c)中の番号に対応す る.

S_n(A) に属する任意の点 Pを選び, OP 間を結ぶ 直線の角度 を求める(3次元の場合は θ, ϕ). この直線に対応する画素列を求め,これを検索 対象とする.

検索対象の画素列中, OP 方向で P に隣接する 点を調べ, O を中心として P より外側に同じ S_(A)に属するスケルトンが存在しない事を確 認する.存在しない場合は処理 ,存在する場 合は他のS_a(A)に属する点を対象として処理 に戻る.

Pより PO 方向に直線上の点を順に探索し,最 初に同じ $S_n(A)$ に属さない点Qを調べる.

PQ 間の距離を求め, 広がりの値 m とする.得 られたパラメータを (r, θ) 空間(3次元では (r, θ, φ) 空間)ヘプロットする.



3.3 SIMS の性質

SIMS は, 元画像の空間的・位相的変化に対する ロバスト性を得るため,スケルトン部分集合を変換 した特徴情報である.そのため,スケルトンの持つ 性質とスケルトンによらない性質を併せ持つ.

SIMS の構造要素に対する依存性 3.3.1

SIMS は, スケルトン部分集合の分布を中心から の広がりとして捉え,極座標系に置き換えたもので ある .そのため構造要素として用いる円(3次元では 球)の半径が小さくなるほど広がりは減少し,逆に半 径が大きくなるほど広がりは増大する.この例を図 5 に示す.先に図1では,元画像に対し半径3 [pixel] と半径 11 [pixel]の円形構造要素によりスケルトン 化を行った結果を示した.さらにそれを SIMS へ変 換した結果が図5である.ただし簡略化のため, SIMS はスケール2のスケルトン部分集合のみを示 す.図より,半径3と半径11のSIMSは,広がり 方向に大きな差が生じ,円形構造要素の半径が大き いほど広がりが増大する傾向が分かる.



■構造要素半径3 △構造要素半径11

3.3.2 SIMS の階層性

SIMS は,それぞれのスケルトン部分集合より得 られるため,階層性を保持している.この例を図6 に示す.図6(a)の元画像に対して半径7 [pixel]の 円形構造要素によりスケルトン化した結果が図6 (b)である.これを SIMS に変換した結果が図6(c) である.スケールの小さいスケルトン部分集合の SIMS は位相全域に分布し,広がりが小さい.逆に スケールの大きなスケルトン部分集合の SIMS は, 特定の位相領域において広がりが明確に分かる分布 を示している.



図6.SIMSの階層性

3.3.3 SIMS で解析可能な形状

3次元形状の記述手法として,従来より提案され ている超2次関数とその組合わせによる記述手法と SIMSを比較した場合,超2次関数では定義不可能 な,非対称でいびつな形状に対してもSIMSは記述 可能という点が長所として挙げられる.ただし SIMSで記述可能な形状には制限がある.SIMSは 式(7)で定義されるため,解析可能な形状は,解析の 起点として中心点に用いる距離値極大の点が1点と なるような形状に限定される.またスケルトンの分 布を中心点からの広がりとして極座標で表すため, 形状は中心点から放射状に広がった形に限定される.

中心点が連続する場合,あるいは複数の中心点が存在する図7に示すような形状の場合,SIMSを用いた解析を行うためには他の何らかの処理を必要とする.



図7.SIMS による解析が困難な形状

複数の中心点が存在するような形状を解析対象と する場合は,形状の分割処理が必要となる.中心点 が連続するような長方形やトーラス等の形状を解析 対象とする場合は,連続する中心点の分布を解析す る必要がある.

4. SIMS の分解能 - 角に対する分解能 -

SIMS で解析可能な形状の範囲を求めるため,定 量的な比較に基づき SIMS の分解能を調べる.3次 元形状は,辺・頂点・稜線・曲面等により構成され るが,ここでは分解能を計るための指標として,頂 点と辺により構成される角に注目する.どの程度の 角度まで角の存在を確認できるかを計るため,問題 を簡略化し角の集合で構成される2次元画像を解析 対象とする.

4.1 分解能の解析方法

次に示す2つの方法を分解能の解析に用いる.

a. 広がり基準

SIMS における広がりの極大値を分解能の基準と する(図8(a)).SIMS における一定の位相領域内 において,広がりの値が極大となる点を計測する. 即ち対象画像は,広がり値が極大を取る位相方向に 広がる形状として評価する.対象とする位相領域は 実験的に 0.5 [rad]とする.

b. 位相基準

SIMS を位相方向でクラスタリングし,クラス数 を分解能の基準とする(図8(b)).即ち対象画像 は,SIMS の分布が集中する位相方向に広がる形状 として評価する.クラスタリングはクラスタを動的 に生成する手法として一般的な NN(Nearest Neighbor)法[10]を用いる.クラスタリングを行う位 相方向の類似度の閾値は実験的に 0.3 [rad]とする.



4.2 分解能の検証方法

角数が段階的に異なる正多角形を解析対象とする. ここで述べる正多角形とは, k 個の角を持つ多角形 において,角の角度がいずれも等しい多角形とする. ただし実験対象は, k が 3 k 15, k Z である多角 形とする.実験画像の例として, k=3, 10, 15 の場合 をそれぞれ図9 (a),(b),(c)に示す.それぞれの SIMS を求め, a, b 2 つの手法で解析を行う.角数 k の正 多角形と,解析により検出された角数 k'が一致した 場合,その多角形を構成する角の角度は検出可能で ある事が確認される.角数 k における正多角形の一 つの角の角度 r [rad]は式(11)で表される.

$$r = (k-2)\pi/k \tag{11}$$

入力画像は 256×256 [pixel]の 2 次元画像とし, 構造要素は半径 7,9,11 [pixel]の円形構造要素を 用いる.

表 1. 半径 7 広がり基準による分解能



実験結果を表 1 ~ 6 に示す.解析により検出され た角数 k'が,入力画像の角数 k と一致した場合を で示す.形状より得られた SIMS を表中のグレー領 域で示す.

構造要素の半径が 11 [pixel]の時 広がり基準によ る分解能の実験結果(表 5)より, k =6,角度にして 120°相当までがある.即ち SIMS により検出さ れた角数 k'が,入力画像の角数 k と一致しており, 120°相当の角度の角まで検出可能である事を示す.

同様に,位相基準による分解能の実験結果(表 6) では,*k*=10,角度にして144。相当の角まで検出可 能である事がわかる。

ただし,いずれも離散空間中の画素で表された画像における角度であり,画像から厳密に角度を求める事はできないため,角度は式(11)より元画像の角数から求めた.

[°]

128.6

144.0



表3.半径9 広がり基準による分解能







表 2. 半径 7 位相基準による分解能



(a) k = 3



(b) *k* = 10



(c) *k* = 15 図 9 . 実験画像

全体的に,広がり基準よりも位相基準の方がより 高い分解能が得られる傾向がある.また,スケール 値の大きい SIMS は大局的な情報を表すが,多重解 像度表現のように大局的情報ほど分解能が悪化する 傾向は見られない.

構造要素に対する分解能の傾向として,円形構造 要素を用いた場合の SIMS の分解能は,円の半径が 大きいほど分解能が高くなり,代わりに階層数が減 少する傾向が見られる.

以上の結果より,高い分解能を得るためには円形 構造要素の半径を大きくする必要があり,半径 11 において解析可能な角の上限角度は144。相当の角 であることが分かった.ただし今回の分解能の検証 では,元画像の解像度が変化した場合の検討を行っ ていないため,元画像の画像サイズにより SIMS の 傾向も変化する可能性がある.

5. SIMS の分解能 - 曲線に対する分解能 -

曲線に対し SIMS がどのような傾向を示すかを調べるため,曲線に対する SIMS の分解能を調べた. 分解能の解析手法には先に述べた2つの手法を用いる.

5.1 分解能の検証方法

曲線に対してどのような SIMS の傾向が表れるか を調べるため,曲率半径を基準として解析を行う. 曲率半径とは曲線の曲がり方を表すパラメータで あり,平面曲線 C 上の点 P における曲率半径とは, 点 P で C を局所的に近似した時の円の半径に一致す る(図 10).なお曲率半径の詳細は文献[11]に譲る.



図 10.曲率半径

解析対象には,既に分解能が確認された90°の角 で構成される正方形を基に,その角の一つに対して 設定した曲率半径に沿って角を欠損させた形状を用 いる.曲率半径を*R* [pixel]とし,10 *R* 100の範 囲で*R*を10づつ段階的に変化させた形状を用意す る.実験画像の例として,*R*=10,50,100の場合をそ れぞれ図 11(a),(b),(c)に示す.

実験画像を a, b 2 つの手法で解析し,検出された 角数 k'が4の場合,即ち角の欠損した方向へも角と しての広がりを検出する場合をとする.また検出 された角数が3の場合,即ち欠損した角方向には, 角の存在を検出しない場合をとする.

入力画像は 256 × 256 [pixel]の 2 次元画像とし, 基となる正方形は 151 × 151[pixel]とする 構造要素 は半径 7,9,11 [pixel]の円形構造要素を用いる.

5.2 実験結果·考察

実験結果を表7~12に示す.形状より得られた SIMS を表中のグレー領域で示す.広がり基準によ る分解能の実験結果(表 7,9,11)より,広がり基準で は*R*=10から*R*=60までとの分布が段階的に変 化する.

スケール値との対応を見ると,スケール値が大き いほどが分布し,スケール値が小さいほどが分 布する.スケール値の大きさは,元形状における大 局性・局所性を表す.このため,大局的には角数4 の形状として検出し,局所的には角数3の欠損方向 に角の無い形状として検出する.

R = 70 以上からは全てのスケールにおいて が検 出されなくなる.即ち欠損した角方向へは,角の存 在が確認されない.

位相基準による分解能の実験結果(表 8, 10, 12) の場合においても,こうした傾向に大きな違いは見 られない.ただし位相基準では,R=10において全 てのスケールでが分布し,欠損した角と欠損の無 い角との違いを評価できていない.

構造要素に対する分解能の傾向として,円形構造 要素を用いた場合の SIMS の分解能は,構造要素円 の半径が小さいほど曲率半径に対する分解能が高く なる傾向が見られる.しかし角に対する分解能の傾 向ほど大きな変化はみられない

以上の結果より, R =60以下の曲率半径を持つ曲線に対し,大局的には角として,局所的には曲線としての評価が可能であると言える.ただし角に対する分解能の検証と同様に,元画像の解像度が変化した場合,これらの傾向も変化する可能性がある.

6. おわりに

3次元画像解析を目的とし,空間的・位相的にロ バストで階層的に形状特徴を表す新たな特徴情報と して SIMS を提案した.SIMS の分解能を定量的な 比較に基づいて検証し,その性質を調べた.その結 果,SIMS は中心点より放射状に広がる形状を解析 可能であり,144。相当の角度まで角として検出可 能である事が分かった.また曲線については,曲率 R=60 までは,大局的には角を検出し,局所的には 角の無い曲線としての評価が可能である事が分かっ た.

これら SIMS の分解能の傾向を踏まえ,今後は実際に形状認識・推定を行うための具体的な評価モデルを作成すると同時に,SIMS を拡張し,より複雑な形状への適用を考えていく予定である.

文 献

[1] 堀田 裕弘,北村 聡宰, Han Tee Siew,村井 忠邦:"超2 次関数とCSG 表現を用いた3次元物体の形状記述の基礎 検討",信学論, Vol.J82-D-II, No.4 pp.790-797, 1999.4.

- [2] 熊沢 逸夫: "セルラーHough 変換による形状抽出",電子 情報通信学会技術研究報告, Vol.96, No.435, (PRMU96 104-117) pp.9-16, 1996.
- [3] 堀越 力,末永 康仁,中根 一成:"超2次関数膨張法と球 面調和関数による3次元形状の記述",信学論, Vol.J78-D-II, No.1 pp.50-60, 1995.1.
- [4] 清水昭伸,松阪匡芳,長谷川純一,鳥脇純一郎,鈴木隆 一郎: "動的輪郭線モデルを用いた輪郭線抽出手順の自 動構成と胸部 X 線像上の肺輪郭抽出への応用",コンピュ ータ支援画像診断学会誌,1,1,pp.1-11,1997.8.
- [5] コマツソフト株式会社:"形状特徴マイニングエンジンの開発",高度情報化支援ソフトウェアシーズ育成事業論文,00 第 001 号,2001.1.
- [6] Gunilla Borgefors, Gabriella Sanniti di Baja, and Stina Svensson: "Deconposing Digital 3D Shapes Using a Multiresolution Structure", DGCI/99, LNCS 1568, pp.19-33, 1999.
- [7] 小畑 秀文: "モルフォロジー", コロナ社, 1996.
- [8] 小畑 秀文: "3 次元画像とモルフォロジー", MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY, Vol.19 No.3, pp.168-173, May 2001.
- [9] 齋藤 豊文, 鳥脇 純一郎:"3次元ディジタル画像に対する ユークリッド距離変換", 信学論, Vol.76-D-II, No.3 pp.445-453, 1993.3.
- [10] 宮本 定明: "クラスター分析入門", 階層的クラスタリング, pp88-105, 森北出版株式会社, 1999.
- [11] 杉原 厚吉∶"グラフィックスの数理",曲線の表現, pp107-110,共立出版株式会社,1995.

表7.半径7 広がり基準の分解能

	スケール									
R	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10										
20										
30										
40										
50										
60										
70										
80										
90										
100										

表8.半径7 位相基準の分解能





(a) *R*=10

表 9.半径 9 広がり基準の分解能



表 11.半径 11 広がり基準の分解能



表 10. 半径 9 位相基準の分解能



表 12. 半径 11 位相基準の分解能





(b) R=50

(c) *R*=100 図11.実験画像